

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	4
I.3 Batasan Masalah	4
I.4 Tujuan Penelitian	4
I.5 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB III DASAR TEORI	18
III.1 Gelombang Elektromagnetik	18
III.2 Gelombang Cahaya Terpolarisasi- <i>p</i> dan - <i>s</i>	20
III.3 Reflektansi dan Transmittansi	21
III.4 Polarisasi Cahaya	22
III.5 Prinsip Pengukuran Ellipsometri	22
III.6 Konfigurasi Ellipsometer	24
III.7 Interferensi Optik	26
III.8 Kalibrasi Elemen Optik	28

III.9 Model Fungsi Dielektrik	29
BAB IV METODE PENELITIAN	31
IV.1 Alat dan Bahan Penelitian	31
IV.2 Langkah Penelitian	33
IV.3 Pengukuran ellipsometri	38
IV.4. Analisi Data	40
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	43
V.1 Simulasi Ellipsometri	43
V.2 Hasil Eksperimen Pengukuran Ellipsometri untuk Emas (Au)	49
V.3 Hasil Eksperimen Pengukuran untuk Material silikon (Si)	53
V.4 Hasil Eksperimen Pengukuran untuk Material SiO ₂	56
V.5 Hasil Eksperimen Pengukuran untuk Material Graphene/SiO ₂	59
V.6 Koreksi dengan memasukkan faktor matriks Jones untuk <i>beam splitter</i>	62
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	69
VI.1. Kesimpulan.	69
VI.2. Saran.	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	